

テラヘルツ波パルスの偏光制御・計測  
および複屈折性材料の評価

17SD204 河田陽一氏（博士課程1年）

**4月25日(水)10:30～ 総合研究棟 W202**

テラヘルツ波技術の特徴の一つは、電磁波としての「電場」の時間展開を容易に直接観測できることである。これは「強度」を検出する通常の光との大きな差である。電場の振る舞いにより決まる特徴量の代表的なものに「偏光」があるが、これまでテラヘルツ帯において偏光の制御手法、計測手法はともに確立されていなかった。本研究ではテラヘルツ波の新たな偏光の制御・計測手法を考案・実現し、応用として複屈折性材料の評価手法へ適用できることを示した。

どなたでも気軽に参加下さい。

世話人：武田 淳（3953） 片山郁文（3695）